PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Corresponding reference 2

(11)Publication number:

10-212591

(43) Date of publication of application: 11.08.1998

(51)Int.Cl.

C25D 3/12

C25D 3/56

(21)Application number: 09-029603

(71)Applicant: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

C UYEMURA & CO LTD

(22)Date of filing:

29.01.1997

(72)Inventor: YODA TOSHIHISA

NEGISHI TORU MURAKAMI TORU IEJI TOMOMI

NAKAMURA TAICHI **SEKIYA TSUTOMU**

(54) NICKEL ELECTROPLATING BATH OR NICKEL ALLOY ELECTROPLATING BATH AND PLATING METHOD USING THE BATH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plating bath by which a material partly masked with an org. high molecular resist layer is plated without the resist layer from being blistered. SOLUTION: A salt consisting of one or ≥2 kinds of cations selected from ammonium ion. magnesium ion, calcium ion, aluminum ion or barium ion is added as a conductive salt to a nickel electroplating bath contg. a water-soluble nickel salt or a nickel alloy plating bath contg. the water-soluble salt of a metal capable of being alloyed with nickel, and the conductive salt is substantially free from sodium ion and potassium ion as the cations.

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 419530

[44]中華民國 90年 (2001) 01月 21日

發明

全 2 頁

[51] Int.Cl 06: C23C18/44

[54]名 稱: 鎳或鎳合金電鍍浴及使用彼之電鍍法

[21]申請案號: 086115397

[22]申請日期: 中華民國 86年 (1997) 10月 18日

[30]優先權: [31]29603 [32]1997/01/29 [33]日本

口木

[72]發明人:

 村上透
 日本

 家治友美
 日本

 仲村太一
 日本

 關谷勉
 日本

 依田稔久
 日本

根岸徹 [71]申 請 人:

新光電氣工業股份有限公司 日本 上村工業股份有限公司 日本

[74]代 理 人 : 林志剛 先生

1

2

[57]申請專利範圍:

1.一種鎳或鎳合金電鍍浴,其係用於電 鍍被有機高分子保護層所部份遮蓋之 導體,

其中該鎳電鍍浴含有水溶性鎳鹽,且 該鎳合金電鍍浴同時含有水溶性鎳鹽 及可與鎳形合金之金屬的水溶性鹽 類,

該鎮電鍍浴的水溶性鎳鹽含量,或該 鎮合金電鍍浴的水溶性鎳鹽及可與鎳 形成合金之金屬的水溶性鹽類含量在5 克/升至40克/升之間(以鎳離子轉化 率為基準),

該鎮或鎳合金電鍍浴摻混含至少一種 選自包括鈹雕子、鎂離子、鈣離子、 鋁離子及鋇離子之陽離子的導電性鹽 類,且

該導電性鹽類實質上不含納離子或鉀 離子作為陽離子。

2.如申請專利範圍第1項之鎳或鎳合金電

鍍浴,其中在使用 Haring 電池於兩個 陰極板與陽極板之間的距離比例視為 5 的情形下,電鍍裕的大量投入能力值 (macrothrowing power)為10%或更高。

3.一種鎳或鎳合金的電鍍法·其步驟包 括:

將被有機高分子保護層所部份遮蓋之 導體浸漬在如申請專利範圍第1項之 電鍍浴中;及

10. 使用該導體作為陰極並施加電流至電 鍍浴中,其中陰極的電流密度為 0.1 至 4A/dm²,溫度為 45 至 65℃,及電鍍浴 的 pH 值為 3.5 至 5.4:

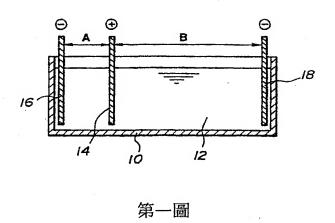
> 於是在該導體被保護層所遮蓋以外之 暴露的部份形成鎳或鎳合金膜,且該 保護層不會浮動。

圖式簡單說明:

第一圖是測量大量投入能力之 Haring 電池之截面圖。

15.

5.



	1	-		告	4			
申	請	日	期		86	年	10	J
金			舞			961	7 = 90	.7

申請日期 86 年 10 月 18 日 案 號 86115397 類 別 C23C \8/44

A4 C4

419530

線

(以上各欄由本局填註) Int.

	*	以上各欄	由本局填註)						
			發明專利說明書新型專利說明書						
	· 發明 名和	中或	線或 鎮合金電鍍浴及使用彼之電鍍法						
	新型石架	英文	Nickel or nickel alloy electroplating bath and plating process using the same						
		姓名	(1) 村上透 (2) 家治友美 (3) 仲村太一						
		國籍	(1) 日本 (2) 日本 (3) 日本						
=	、發明人		(1) 日本國大阪府枚方市出口一丁目五番一號						
	想几件	住、居所	(2) 日本國大阪府枚方市出口一丁目五番一號						
			(3) 日本國大阪府枚方市出口一丁目五番一號						
		姓 名 (名稱)	1 英业聚与工类推进众外						
			(2) 上村工業股份有限公司 上村工業株式会社						
		國 籍	(1) 日本 (2) 日本						
三、	申請人	住、居所 (事務所)							
		n t	② 日本國大阪府大阪市中央區道修町三丁目二番 六號						
		代表人姓名	1 24						
			② 上村寬也						
			<u>-</u>						

419530

	中	請日期	86	年	10	月	18	·日
-	案	號	-	861	1539	17		
	類	別						

A4 C4

()	以上各欄由	本局填註)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	發明 專 利 説 明 書 新型 專 利 説 明
一、發明	中文	
新型石研	英文	
	姓名	(4) 関谷勉 (5) 依田稔久 (6) 根岸徹
二、發明人	國籍	(4) 日本 (5) 日本 (6) 日本 (4) 日本國東京都台東區鳥越一一一二
	住、居所	(5) 日本國長野縣長野市大字栗田字舍利田七一一番地(6) 日本國長野縣長野市大字栗田字舎利田七一一
·		番地
	姓 名 (名稱)	
	國籍	·
三、申請人	住、居所 (事務所)	
	代表人姓名	
	į ·	

經濟部中央標準局員工消费合作社印製

く辨ノ	人代碼	:		 	
=	類	:			
D	マム和				

A6 B6

太	奓	P	向	:

_	申請專利,申請日期: 1997 年 1 月 29 日	案號: 9-29603	・□有 □無主張優先権 □有主張優先権
日本	1997 年 1 月 29 日	\$ Z3000	

有關微生物已寄存於:

,寄存日期:

,寄存號碼:

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

缐

四、中文發明摘要(發明之名稱。錄或錄合金電鍍浴及使用彼之電鍍法揭示一種錄或錄合金電鍍浴,供電鍍被有機高分子保護層部份遮蓋之導體使用,其中鎳電鍍浴含水溶性鎳鹽,且鎳合金電鍍浴同時含水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類,上述電鍍浴掺混含至少一種選自包括銨離子、鎂離子、鈣離子、鋁離子及鋇離子之陽離子的導電性鹽類,而且該導電性鹽類實質上不含鈉離子或鉀離子之陽離子,這種電鍍浴可電鍍被有機高分子保護層部份遮蓋之導體而不會浮動該保護層。

英文發明摘要(發明之名稱: Nickel or nickel alloy electroplating bath and plating process using the same

Disclosed is a nickel electroplating bath or a nickel alloy electroplating bath used for electroplating a conductor partially masked with an organic high-molecular resist layer, wherein the nickel electroplating bath contains a watersoluble nickel salt, and the nickel alloy electroplating bath contains both a water-soluble nickel salt and a water-soluble salt of a metal capable of being alloyed with nickel. above electroplating bath is incorporated with an electrical conductive salt containing at least one cation selected from the group consisting of an ammonium ion, magnesium ion, calcium ion, aluminum ion, and barium ion. Further, the electrical conductive salt substantially does not contain a sodium ion and a potassium ion as cations. Such an electroplating bath is capable of electroplating a conductor partially masked with an organic high-molecular resist layer without floating of the resist layer.

五、發明説明 (

發明說明

本發明係關於一種鎳或鎳合金電鍍浴,供電鍍被有機高分子保護層部份遮蓋之導體使用,被焊料保護層部份遮蓋之印刷電路板,以及使用此電鍍浴之電鍍法,具體地說,本發明係關於一種鎳或鎳合金電鍍浴,可電鍍上述導體而不會在電鍍過程中浮動(剝落)上述保護層。

鎮或鎳合金電鍍浴已經備用在印刷電路板上,具體地說,在印刷電路板上部份形成一種有機高分子的保護膜(在印刷電路板的領域中經常稱其爲焊料保護膜),並在被保護膜遮蓋以外的部份進行鎳或鎳合金電鍍。

上述電鍍法之進行是使用Watts型鎳電鍍浴, 其中主要含硫酸鎳及氯化鎳,但是此種Watts型鎳 電鍍浴的大量投入能力不良,因此,希望能發展出可促進 大量投入能力之新型電鍍浴。

頃經發現可強化大量投入能力之鎳或鎳合金電鍍浴,例如日本專利申請案 H e i 2 - 2 2 1 5 8、 H e i 2 - 2 2 1 5 8、 H e i 3 - 1 9 3 0 8 及 H e i 3 - 1 9 3 0 9 ,在這些電鍍浴中,電鍍金屬例如鎳的濃度相當低,並摻混高濃度之導電性鹽類例如鹼金屬、鹼土金屬或鋁之鹵化物、硫酸鹽或胺基磺酸鹽,具體地說,特別是使用鈉鹽或鉀鹽作爲上述之導電性鹽類。

但是上述強化大量投入能力之鎳或鎳合金電鍍浴具有缺點,具體地說,在大量情形下當使用上述被保護層遮蓋

雷丁

五、發明説明()

必須注意上述Watts型電鍍浴不會顯示保護層浮動之現象,但是如上所述,其大量投入能力不良。

鑑於上述之情形,有需要發展具有高的大量投入能力但不會浮動保護層之鎳或鎳合金電鍍浴。

發明概述

本發明之目的是提供一種鎳或鎳合金電鍍浴,其可在高的大量投入能力下電鍍被有機高分子保護層部份遮蓋之導體而不會浮動該保護層,以及提供使用此電鍍預知方法

本案發明者進行實驗研究以達到上述之目的,並發現供錄或錄合金電鍍浴使用之導電性鹽類對於保護層之浮動有很大的影響,具體地說,頃經發現使用鈉離子或鉀離子作爲陽離子之導電性鹽類,會造成保護層之浮動,但是使用鈹離子、鎂離子、鋁離子、鈣離子或鋇離子作爲陽離子

五、發明説明()

之導電性鹽類,不會造成保護層之浮動,因此,頃經發現 具有高的大量投入能力且不會浮動保護層之鎳或鎳合金電 鍍浴,可經由添加含NH4⁺、Mg²⁺、Al³⁺、Ca²⁺ 、及/或Ba²⁺之高濃度導電性鹽類而獲得,因此基於上 述之瞭解而達成本發明。

據此,本發明提供:

(1)一種鎳或鎳合金電鍍浴,供電鍍被有機高分子保護層部份遮蓋之導體,其中鎳電鍍浴含水溶性鎳鹽,且 鎳合金電鍍浴同時含水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類,其特徵是此鎳合金電鍍浴摻混含至少一種 選自包括銨離子、鎂離子、鈣離子、鋁離子及鋇離子之陽 離子的導電性鹽類,此導電性鹽類實質上不含鈉離子或鉀

(2)一種根據第(1)項之鎳或鎳合金電鍍浴,其中鎳電鍍浴的水溶性鎳鹽含量,或鎳合金電鍍浴的水溶性 鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類含量在5克/ 升至40克/升之間,以鎳離子轉化爲基準;

(3)一種根據第(1)或(2)項之鎳或鎳合金電鍍浴,其中在使用 Haring電池於兩個陰極板與陽極板之間的距離比例視爲5的情形下,電鍍浴的大量投入能力值爲10%或更大;及

(4)一種鎳或鎳合金的電鍍法,其步驟包括:將被高分子保護曆部份遮蓋之導體浸漬在第(1)至(3)項任一項之電鍍浴中;使用導體作爲陰極並施加電流至電鍍

五、發明說明()

浴中;於是在導體被保護層遮蓋以外之暴露部份形成鎳或鎳合金膜。

本發明之電鍍浴爲何可防止保護層浮動之機制尚不清 楚 , 但 是 對 於 含 N a ⁺ 或 K ⁺ 之 導 電 性 鹽 類 之 相 關 技 藝 的 電 鍍浴,可視爲Na⁺或K⁺在例如電滲之機制原理下透入保 護層內,並提高塗膜之保護層,因此造成保護層之浮動, 在此情形下,其也可視爲在基底物質與保護層之間的金屬 氧化物,由於氫氣之產生而減少,或產生的氫氣透入保護 層下方並汽化,因而提高保護層並因此造成保護層之浮動 ,但是並沒有發現電鍍時產生的氫氣量與保護層的浮動有 任何關係,除此之外,陽離子(NH4+、Mg2+、 A 1 3 + 、 C a 2 + 、 B a 2 +) 之各氫化分子,不會造成保 護層之浮動,其具有大的體積,因此很難透入保護層內, 結果使得不容易造成保護層之浮動,或者是對於含Na⁺或 K + 的 導 電 性 鹽 類 , 當 氫 氣 產 生 時 , 在 電 鍍 界 面 產 生 NaOH或KOH,使得電鍍界面之鹼性更強;但是對於 含不會造成保護層浮動的陽離子之導電性鹽類,電鍍界面 之鹼性低於含Na[†]或K[†]的導電性鹽類,總之,本發明之 電鍍浴爲何可防止保護層浮動之確實機制尚不清楚。

較佳具體實施例之詳細說明

一種本發明之鎳或鎳合金電鍍浴,其中主要含電鍍金屬之水溶性鹽類及水溶性導電鹽類。

在鎮電鍍浴之情形下,對於電鍍金屬之水溶性鹽類係

五、發明說明 6

包括硼酸及水溶性有機羧酸類例如檸檬酸、酒石酸、琥珀酸、及醋酸,以及其鹽類,至於這些鹽類,較宜使用銨鹽、鎂鹽、鋁鹽、鈣鹽、鋁鹽及鋇鹽,緩衝液之濃度範圍較宜爲20至100克/升。

本發明之電鍍浴中也可添加已知的主要或次要鎳電鍍亮光劑,例如糖精、丁炔二醇或其衍生物,在此情形下,主要亮光劑之含量範圍較宜爲0.1至5克/升,且次要亮光劑之含量範圍較宜爲0.01至3克/升,而且,可加入0.01至10克/升的共沈積形式之亞磷酸、磷酸、或其鹽類: 胼化合物、二甲基胺硼烷、或三甲基胺硼烷

本發明之電鍍浴實質上不含鈉離子或鉀離子, "實質上不含鈉離子或鉀離子"係指鈉離子或鉀離子的含量爲 5克/升或更低,尤其是 3克/升或更低,例如,可加入非常少量之糖精作爲鈉鹽,或加入低於上述限制範圍之羧酸鈉或羧酸鉀作爲緩衝液。

本發明之電鍍浴的 p H 範圍較宜在 3 . 5 至 5 . 4。 本發明之電鍍浴的大量投入能力,其係使用 Haring 電池於兩個陰極板與陽極板之間的距離比例視爲 5 的情形下測量,較宜爲 1 0 %或更高,更宜爲 1 5 %或更高,使用Haring電池測量大量投入能力之方法顯示在圖 1 並係根據日本專利公告 H e i 2 - 2 2 1 5 8 之揭示,在圖 1 中,Haring電池 1 0 的長度爲 2 4 0 毫米,寬度爲 6 3 毫米且深度爲 1 0 0毫米,其中含 1 5 0 0毫升之電鍍溶液

五、發明說明(

使用水溶性鎳鹽例如硫酸鎳、氯化鎳、溴化鎳、胺基磺酸镍、或甲基磺酸镍;在鎳合金電鍍浴之情形下,對於電鍍金屬之水溶性鹽類除了上述水溶性鎳鹽以外,還使用可與鎳形成合金之金屬例如鈷或鐵的水溶性鹽類,例如鈷、鐵等之硫酸鹽、氯化物、溴化物、胺基磺酸鹽、或甲基磺酸鹽。

上述電鍍金屬之水溶性鹽類含量範圍較宜在 5 至 4 0 克 / 升,更宜在 7 至 4 0 克 / 升,以鎳離子之轉化爲基準,當其低於 5 克 / 升時,電鍍所需之陰極電流密度必須很小而無法實際使用;當其大於 4 0 克 / 升時,電鍍浴之大量投入能力降低。

水溶性導電鹽類含至少一種選自包括銨離子、鎂離子、鋁離子、鈣離子及鋇離子之陽離子,必須注意此導電性鹽類實質上不含鈉離子或鉀離子之陽離子,而且,此水溶性導電鹽類含至少一種選自包括硫酸、氫氯酸、氫溴酸、胺基磺酸及甲基磺酸之陰離子,至於水溶性導電鹽類可以使用至少一種選自上述酸類之銨鹽、鎂鹽、鈣鹽、鋁鹽及銀鹽。

上述導電鹽類之含量範圍較宜爲50至800克/升, 更宜在150至500克/升, 當其低於50克/升時, 電鍍浴之電阻沒有降低很多且因此使得大量投入能力不足; 當其大於800克/升時, 額外的效應沒有明顯地增加,且因此降低其實用性。

本發明之電鍍浴中可掺混緩衝液,緩衝液之特定實例

五、發明説明 (

12,編號14爲陽極且編號16及18爲需要電鍍之陰極,在本發明中,提供陽極14使得陽極14與第一個陰極16之距離A及陽極14與第二個陰極18之距離B的比例爲5(=B/A),在預先決定之時間內進行電鍍,在陰極16及18上沈積電鍍膜,測量沈積在陰極16及18上電鍍膜之重量,從下列公式計算大量投入能力:

T (%) =
$$\frac{P-M}{P+M-2} \times 1 \ 0 \ 0$$

其中

T: 大量投入能力

P:距離比例 B / A (=)

M: 重量比例 M 1 / M 2 其中 M 1 為沈積在第一個陰極 1 6 上電鍍膜之重量,且 M 2 為沈積在第二個陰極 1 8 上電 鍍膜之重量。

強化大量投入能力之電鍍浴適宜用在電鍍例如印刷電路板等,也就是說,與低的大量投入能力之電鍍浴比較,在相同電鍍情形下,在相同部位形成的鎳電鍍膜之厚度投化小,更特定地說,最小電鍍厚度大於使用低的大量投入電鍍浴之情形,使得當在上述電鍍膜上鍍金時,線路結合之失敗數下降。

五、發明説明()

本發明之電鍍浴是用於電鍍被有機高分子保護層部份 遮蓋之物質(導體),在此情形下,物質之種類沒有特別的限制,但是較宜使用印刷電路板,形成有機高分子保護層的方法沒有特別的限制,例如,可以使用塗覆溶劑型態、熱固性型態或顯像(鹼顯像)型態之保護物質(稱爲焊料保護物)的方法,並用已知的方法形成保護層;或施加電鍍遮蓋物質例如遮蓋膠帶之方法。

使用本發明之電鍍浴電鍍上述物質之電鍍情形可以適當地選擇,例如,電鍍溫度範圍較宜爲45至65℃,且陰極電流密度較宜爲0.1至4安培/分米²,攪動較宜在0.2至7米/分鐘的陰極搖動速率下進行,可以使用緩慢的空氣攪動或螺旋槳攪動之液體攪動,但是不要用強烈的空氣攪動或強烈的液體攪動,此外,可以使用鎳板等作爲陽極,其與在已知的鎳或鎳合金電鍍中使用的相同。

使用本發明之鎳或鎳合金電鍍浴,可將已知的預先處理施加在需要電鍍之物質上,從上述浮動保護層之觀點來看,此預先處理因爲會經由電解而產生氫氣,所以必須避免,例如不會產生氫氣的浸漬脫脂優於陰極電解脫脂,在使用電解脫脂器的情形下,可經由不使用Na⁺及K⁻但使用NH₄⁺、Mg²⁺、Al³⁺、Ca²⁺、及/或Ba²⁺作爲關離子而防止浮動保護層。

上述鎳或鎳合金電鍍後,可進行金屬電鍍、金電鍍、 鈀或鈀合金電鍍、銀電鍍、或鉑電鍍。

本發明之電鍍浴,如上所述,可電鍍被有機高分子保

五、發明説明()

護層部份遮蓋之導體而不會浮動該保護層。

實例

參照下列的發明實例及實例比較,將可更清楚地了解 本發明。

實例1

在此實例中,係使用具有下列組成之鎳電鍍浴:

MgSO4 • 7 H 2 O

400克/升

N i C 1 2 * 6 H 2 O

5 0 克/升

硼酸

4 5 克/升

p H :

4 . 6

在印刷電路板的特定區域上,塗覆 5 至 1 0 0 微米厚度之熱固性型態或顯像(鹼顯像)型態之焊料保護膜,然後使用上述組成之鎳電鍍浴進行鎳電鍍,電鍍情形如下:

五、發明説明(10)

電鍍溫度:

5 5 ℃

攪動:垂直於電鍍表面以1米/分鐘之速率搖動

陰極

電 鍍 時 間:

3 5 分鐘

陰極電流密度: 1 安培/分米²

陽極:

電解鎳

電 鍍 膜 厚 度 :

6 - 9 微米

結果證實大量投入能力良好且完全沒有發現焊料保護 膜浮動。

實例 2

重複實例1,但是使用具有下列組成之鎳一鈷合金電鍍浴:

胺基磺酸銨

200克/升

.N i C 1 2 · 6 H 2 O

70克/升

C o S O 4 . 7 H 2 O

1 克/升

檸檬酸三銨

5 0 克/升

р Н:

4.6

結果證實電鍍膜之厚度在6至10微米之範圍,大量 投入能力良好且完全沒有發現焊料保護膜浮動。 五、發明説明(1)

實例3

重複實例 1 ,但是在實例 1 使用的電鍍浴中額外加入 7 0 克/升的 M g C 1 2 6 H 2 O ,結果證實電鍍膜之厚度在6 . 7至 9 微米之範圍,大量投入能力進一步強化且完全沒有發現焊料保護膜浮動。

實例比較1

重複實例1,但是在實例1使用的硫酸鎂(400克/升)用200克/升的硫酸鈉取代,結果證實電鍍膜之厚度相同於實例1在6至9微米之範圍,但是發現焊料保護膜浮動。

實例比較2.

重複實例 1 , 但是使用具有下列組成之 Watts 型態 鎳電鍍浴:

·N i S O 4 · 6 H 2 O

280克/升

N i C 1 2 · 6 H 2 O

5 0 克/升

硼酸

4 6 克/升

р Н:

4 . 6

結果證實沒有發現焊料保護膜浮動,但是電镀膜之厚度在2至20微米之範圍,且大量投入能力不良。

五、發明説明(12)

其次,在各實例 1 、 2 、 3 及實例比較 1 、 2 中的電 鍍浴之大量投入能力,是在 2 安培的電流並進行空氣攪動 3 0 分鐘下,用 Haring 電池(兩陰極板與陽極板之距離比 例:5)進行電鍍的方法測量,其結果列在表 1。

表 1

	大量投入能力(%)
實 例 1	2 5
實例 2	2 3
實 例 3	3 5
實例比較 1	2 5
實例比較 2	6

從列在表 1 之結果,很明顯地看出在實例比較 2 中使用 Watts 型態 鎳電 鍍 浴 的大量投入能力明顯地不如實例 1、2、3。

雖然在頃經揭示的本發明較佳具體實施例中使用特定之條件,但是必須了解可加以改變及變化而沒有離開下列申請專利範圍之精神或範圍。

附圖之簡要說明

圖 1 是 測 量 大 量 投 入 能 力 之 Haring 電 池 之 截 面 圖。

第 86115397號 專 利 申 請 案 中文說明書修正頁 民國 88年12月修正

4195 30

Α7 **B**7

補充

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

五、發明説明(

圖式符號之簡單說明

- Haring 電池
- 電鍍液 2
- 陽極 4
- 第一陰極 6 1
- 第二陰極 8 1
- 陽極與第一陰極間的距離 A
- 陽極與第二陰極間的距離 В

A8 B8 C8 D8

修正別なりなから

六、申請專利範圍

附件: 1(A)

第 86115397 號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國 88年 12月修正

1. 一種 鎮或 鎮合 金 電 鍍 浴 , 其 係 用 於 電 鍍 被 有 機 高 分 子 保 護 層 所 部 份 遮 蓋 之 導 體 ,

其中該鎮電鍍浴含有水溶性鎳鹽,且該鎳合金電鍍浴同時含有水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類,

該鎮電鍍浴的水溶性鎮鹽含量,或該鎳合金電鍍浴的水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類含量在5克/升至40克/升之間(以鎳離子轉化率爲基準),

該鎮或鎳合金電鍍浴掺混含至少一種選自包括銨離子、鎂離子、鈣離子、鋁離子及鋇離子之陽離子的導電性鹽類,且

該導電性鹽類實質上不含鈉離子或鉀離子作爲陽離子

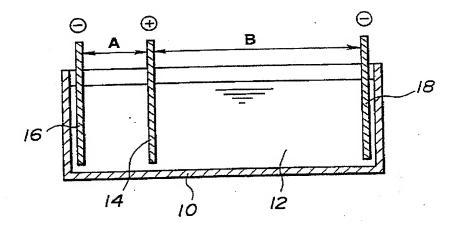
- 2.如申請專利範圍第1項之鎳或鎳合金電鍍浴,其中在使用 Haring 電池於兩個陰極板與陽極板之間的距離比例視爲5的情形下,電鍍浴的大量投入能力值(macrothrowing power)爲10%或更高。
 - 3 . 一種鎳或鎳合金的電鍍法,其步驟包括:

將被有機高分子保護層所部份遮蓋之導體浸漬在如申 請專利範圍第1項之電鍍浴中;及 使用該導體作爲陰極並施加電流至電鍍浴中,其中陰極的電流密度爲 0 . 1 至 4 A / d m²,溫度爲 4 5 至 6 5 ℃,及電鍍浴的 p H 值爲 3 . 5 至 5 . 4 :

於是在該導體被保護層所遮蓋以外之暴露的部份形成鎮或鎳合金膜,且該保護層不會浮劇。



第1圖



Α7 B7

五、發明説明(

圖式符號之簡單說明

- Haring 電池 1 0
- 電鍍液 2 1
- 陽極 1 4
- 第一陰極 1.6
- 第二陰極 1 8
- 陽極與第一陰極間的距離 Α
- 陽極與第二陰極間的距離 В

-16-

A8 B8 C8 D8

修正分りないから

六、申請專利範圍

附件: 1(A)

第 86115397 號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國 88年 12月修正

1.一種 鎳或 鎳合金電 鍍 浴,其係用於電 鍍 被有機高分子保護層所部份遮蓋之導體,

其中該鎳電鍍浴含有水溶性鎳鹽,且該鎳合金電鍍浴同時含有水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類,

該鎮電鍍浴的水溶性鎳鹽含量,或該鎳合金電鍍浴的水溶性鎳鹽及可與鎳形成合金之金屬的水溶性鹽類含量在5克/升至40克/升之間(以鎳離子轉化率爲基準),

該鎮或線合金電鍍浴摻混含至少一種選自包括銨離子、鎂離子、鈣離子、鋁離子及鋇離子之陽離子的導電性鹽類,且

該導電性鹽類實質上不含鈉離子或鉀離子作爲陽離子

- 2.如申請專利範圍第1項之鎳或鎳合金電鍍浴,其中在使用 Haring 電池於兩個陰極板與陽極板之間的距離比例視爲5的情形下,電鍍浴的大量投入能力值(macrothrowing power)爲10%或更高。
 - 3 . 一種鎳或鎳合金的電鍍法,其步驟包括:

將被有機高分子保護層所部份遮蓋之導體浸漬在如申請專利範圍第1項之電鍍浴中;及